

2026年度 機器利用講習会・説明会

申込書を各担当者へメールでお送り下さい

【NMR】

超高分解能核磁気共鳴装置 (ECAシリーズ 及び Lambda500)	
内容:	¹ H NMR測定方法
料金:	無料
講師:	藤高 仁(技術職員)
実施期間:	4月28日(火)~5月29日(金)
場所:	機器分析J棟101室
備考:	"NMR講習2026.xlsx" に必要事項を記入し、 直接藤高にご送付ください。
申込先:	fujitak [at] hirosima-u.ac.jp

【電子顕微鏡】

電子プローブマイクロアナライザ (JEOL・JXA-iSP100)	
内容:	EPMA分析に関する相談、演示など
料金:	無料
講師:	柴田 恭宏(技術職員)
日時:	5月15日(金) ①10:00-12:00、②13:00-15:00、③15:00-17:00
定員:	各回4人まで
場所:	機器分析J棟306室
申込メ切:	5月7日(木)
申込先:	yasshibata [at] hirosima-u.ac.jp
備考:	<ul style="list-style-type: none"> ・EPMA未利用で、今後のご利用をお考えの皆さまのお申し込みを特に歓迎いたします。 ・演示は、できる限りユーザー様お手持ちの試料を用いて行います。 ・今回の講習会の受講は、新規のEPMA利用の必須要件ではありません。

超高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡 (FE-SEM)	
内容:	初めて装置を扱う人向けの講習会
料金:	有料(相互利用として取扱います。2時間で1,000円)
講師:	前田 誠(技術職員)
日時:	5月18日(月)~20日(水) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員:	各回4人まで
場所:	機器分析J棟103室
申込メ切:	4月27日(月)
申込先:	mmaeda [at] hirosima-u.ac.jp
備考:	講習会受講後、1か月以内に装置を使う予定のある人のみ受講可能です

【電子顕微鏡】

超高分解能透過型電子顕微鏡 (TEM, JEM-F200)	
内容:	設備の紹介、デモ観察
料金:	無料
講師:	前田 誠(技術職員)
日時:	6月2日(火)~6月3日(水) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員:	各回5人まで
場所:	機器分析J棟103室
申込メ切:	5月18日(月)
申込先:	mmaeda [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	研究室単位で参加してください。 STEMを使って何ができるのか知りたい人向けの説明会 です。 依頼分析を利用したい人がこの説明会を受ける必要はありません 。装置を自分で使えるようになりたい人は別途担当者にご連絡下さい。

集束イオンビーム (FIB-SEM, Helios G4)	
内容:	イオンビームを用いてできることの紹介・デモ、試料の準備方法などを解説 3次元画像解析ソフト(Amira3D)の紹介
料金:	無料
講師:	前田 誠(技術職員)
日時:	6月9日(火)~6月10日(水) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員:	各回4人まで
場所:	機器分析J棟103室
申込メ切:	5月21日(木)
申込先:	mmaeda [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	研究室単位で参加してください。 FIB-SEMで何ができるのかがイマイチわからない人向けの説明会 です。装置の操作講習を希望する人、依頼分析を希望する人は別途担当者にご連絡下さい。

透過型電子顕微鏡 (JEM-1400Plus), クライオ系試料前処理装置	
内容:	これから生物系試料あるいは微粒子(ウイルス、EV、リポソーム等)のTEM観察をしたい人に。
料金:	無料
講師:	小池 香苗(技術職員)
定員:	4人まで
場所:	機器分析J棟304室
申込メ切:	なし(随時)
申込先:	koikeka [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	<ul style="list-style-type: none"> ・デモンストレーションを交え、装置を紹介します。 ・微粒子観察はすぐに観察できるものもあります。試料ご準備等ご相談ください。 ・今回の講習会では、装置の実際の操作についての講習は行いません。今後のご利用に向けて、試料の準備や測定の前め方などご相談ください。

【質量分析計】

トライブリッド質量分析計 (Orbitrap Eclipse)	
内容:	相互利用・依頼測定に関するご相談、デモ測定、解析ソフトの操作説明など
料金:	無料
講師:	網本 智子 (技術職員)
日時:	5月11日(月)~15(金) ①10:00-11:00、②13:00-14:00、③15:00-16:00
定員:	各回5人まで
場所:	機器分析J棟108室 または Teamsオンラインでも対応します
申込メ切:	5月7日(木) 17時
申込先:	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	<p>・講習会ではなく、本装置を含む質量分析計を使った測定のご相談などをお受けいたします。</p> <p>・相互利用に必要な利用資格を得ていただくための講習会は、実際の分析試料・ご希望の条件にあわせて、改めて有料(相互利用料金)にて実施させていただきます。</p> <p>・依頼測定をご利用中(予定)の皆様のご参加も歓迎致します。</p> <p>【重要】相互利用について</p> <p>本装置が非常に高感度・高機能・高額であり、かつ、装置内部が測定試料で汚染されていく機器であることから、相互利用(=直接測定)は以下の方に限定させていただきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 本新装置の利用資格を得た教職員 ○ 上記の教職員の指導学生(本新装置の利用資格を得た大学院生に限る) <p>詳細は、この説明会の中でもご案内させていただきます。</p>

高性能ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計 (JMS-T2000GC)	
内容:	GC/EI-MS測定方法
料金:	無料
講師:	網本 智子 (技術職員)
日時:	5月18日(月)~22(金) ①10:00-12:00、②14:00-16:00
定員:	各回3人まで
場所:	機器分析J棟108室
申込メ切:	5月13日(水) 17時
申込先:	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	測定したい試料があれば、それを実際に分析しながらご説明致します。 (準備・時間の都合上カラムはHP-5MS UIとし、短時間のメソッドを使用させていただきます)

レーザーイオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-8020)	
内容:	MALDI-TOFMS測定の基本操作
講師:	網本 智子 (技術職員)
料金:	無料
日時:	5月26日(火)~29(金) ①10:00-11:00、②13:00-14:00、③15:00-16:00
定員:	各回5人まで
場所:	機器分析J棟108室
申込メ切:	5月19日(火) 17時
申込先:	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	お手持ちの試料があれば、それを実際に分析してみますのでお持ち下さい。

【X線回折】

単結晶X線構造解析システム (リガク製 XtaLAB Synergy R/DW)	
内容:	実機講習
料金:	500円/1時間で実施。測定時間は試料依存で1~36時間程度。
申込方法	<p>①習熟に時間の掛かる手法ですので、講習会受講の前までに立会測定を複数回ご利用ください。立会測定のお申し込みは、メールにてご連絡ください。申込書の添付は不要です。</p> <p>②①にて、どのような分析手法か十分にご理解された後、自己測定を希望される場合は、実機講習をメールにてお申し込みください。その際に申込書を添付してください。</p> <p>③複数回の実機講習にて、測定原理、機器操作、解析、データの解釈の仕方等について一定の基準を満たす程度に習熟されましたら、利用資格を付与します。</p> <p>※今年度から講習会の内容を変更しています。WEB講習を廃止し、実機講習の前に立会測定での複数回利用を要件としています。ご注意ください。</p> <p>※近いうちに料金の変更を予定しています。同じタイミングで、利用方法等も変更する予定ですので、既に利用資格を取得している方も、使用前には、設備ニュースをご覧ください、更新されていたら、変更点をご確認ください。主な変更点として、利用者間での情報(温度・線源等)伝達ルールの整備等を予定しています。</p>
申込期間:	<p>・下記期間以外は随時受付</p> <p>・繁忙期(11月~2月頃)は新規立会測定および実機講習の申し込みはお断りすることがあります。繁忙期にご利用の可能性のある方は、10月頃までにご連絡をお願いします。</p>
申込先:	kawata [at] hirosshima-u.ac.jp
担当者:	河田 尚美(技術職員)
備考:	<p>・この実機講習の受講は相互利用(自己測定)の要件となります。立会のみご利用の場合は受講の必要はありません。</p> <p>・習熟に時間の掛かる分析手法です。今すぐデータが欲しい方には向いていません。</p> <p>・講習では操作方法の説明を主としており、測定原理や結晶学の基礎には触れませんが、これらの知識は測定・解析時に必須となります。研究分野によっても必要な知識・情報は異なるため、必ず各自で、それぞれに必要な情報を集めてください。</p>

粉末X線回折装置 (リガク製 SmartLab SE)	
内容:	実機講習(90分)
料金:	無料(持ち込み試料は受け付けません)
日時:	5月15日(金), 5月19日(火), 5月22日(金), 5月26日(火), 5月29日(金), 6月2日(火) 各日 10:30-12:00
定員:	各回5人まで
場所:	機器分析J棟307室
申込メ切:	5月11日(月)13:00 締め切り後に決まった受講日をお知らせします
申込先:	kawata [at] hirosshima-u.ac.jp
担当者:	河田 尚美(技術職員)
備考:	<p>・この講習会の受講は相互利用(自己測定)の要件となります。</p> <p>・講習では操作方法の説明を主としています。測定原理等は事前に調べてから来てください。</p> <p>・講習会でお伝えする注意事項を守れない場合は、利用資格を停止することがあります。</p>

【ESR】

電子スピン共鳴装置 (E500)	
内容:	電子スピン共鳴スペクトル(ESR) 測定で分かる事+基本測定講習
料金:	無料
講師:	先進理工系科学研究科 駒口 健治 准教授
日時:	① 5月11日(月) 13:30~17:00 ② 5月18日(月) 13:30~17:00 ③ 5月20日(水) 13:30~17:00 ④ 5月21日(木) 13:30~17:00 4回の講習はすべて同一の内容を行います
場所:	H棟 204室(ESR測定で分かる事)+J棟 109室(基本測定講習)
申込メ切:	5月1日(金)
申込先:	okoma [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	希望日は、可能でしたら第一候補から第三候補までお知らせ頂けると幸いです。 申込者多数の場合には、研究室あたりの人数を制限させていただく場合があります。その際は締切後に連絡代表者の方へご相談をさせていただきます。

【顕微ラマン】

顕微ラマン分光装置 (堀場製作所 XPLORA PLUS)	
内容:	初めて装置を扱う人向けの講習会
料金:	無料
講師:	上野 伊佐子(技術職員)
日時:	5月18日(月)~5月29日(金) ①10:00-11:30、②13:30-15:00
定員:	各回4人まで
場所:	機器分析J棟301室
申込メ切:	5月7日(木)
申込先:	uenoi63 [at] hirosshima-u.ac.jp
備考:	・本講習会を受講いただくことで利用資格を申請いただけます。 ・希望日は、可能でしたら第1候補から第3候補までお知らせいただけますと幸いです。 ・お手持ちの試料があれば、講習と合わせて時間内で可能な範囲で測定いたします。

【CD,CPL】

円二色性分散計 (日本分光 J-1500型)	
個別に対応しております。以下の担当者までお問合せください	
担当者:	先進理工系科学研究科 平尾 岳大 准教授
連絡先:	thirao [at] hirosshima-u.ac.jp

円偏光ルミネセンス測定装置 (日本分光 CPL-200型)	
個別に対応しております。以下の担当者までお問合せください	
担当者:	先進理工系科学研究科 平尾 岳大 准教授
連絡先:	thirao [at] hirosshima-u.ac.jp

【微量元素分析】

微量元素分析システム (I ⁺ -キニルマ-2400 II) …依頼測定用	
現在、担当できるスタッフがいないため、開催予定はありません	

機器分析J棟の機器はこちらでご紹介しています

http://kiki.hirosshima-u.ac.jp/kiki_equip/equip_list.shtml